
Auger Elektronenspectroscopy (AES)



Leibniz Institute
for high
performance
microelectronics

Technische Parameter

Auger Electron Spectrometer:

Physical Electronics PHI 670 Nanoprobe

Ionenquelle: Ar⁺ Ionen (Energie 1-5 keV)

Primärstrahl: fokussierter Elektronenstrahl
(1 - 25 keV) – Feldemitter

Detektiertes Signal: Auger Elektronen,
Sekundärelektronen

Detektierte Elemente: Li-U; Informationen
über chemische Bindungen

Lateralauflösung: 100 nm

Tiefenauflösung: 2 – 3 nm (Tiefenprofile)

Nachweisempfindlichkeit: 0.1 - 1 at%



Einsatzgebiete

- Oberflächenanalyse
- Multipunktanalyse
- Tiefenprofilanalyse von kleinen Strukturen
- Verunreinigungsanalyse
- Zusammensetzung dünner Schichten

Ansprechpartner

Dr. Ioan Costina

Telefon: +49 335 5625 370

Fax: +49 335 5625 327

Email: [costina@ihp-
microelectronics.com](mailto:costina@ihp-microelectronics.com)